05,08

Температурная зависимость спинового тока в гетероструктурах иридат/манганит

© Г.Д. Ульев^{1,2}, К.И. Константинян¹, Г.А. Овсянников¹, И.Е. Москаль¹, А.В. Шадрин^{1,3}

¹ Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН,

Москва, Россия ² Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Москва, Россия ³ Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Долгопрудный, Россия

E-mail: gdulev@edu.hse.ru

Поступила в Редакцию 18 апреля 2024 г. В окончательной редакции 18 апреля 2024 г. Принята к публикации 8 мая 2024 г.

> Представлены результаты экспериментального исследования температурных зависимостей спин-зависимых резистивных характеристик гетероструктуры иридат/манганит (SrIrO₃/La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃), снятых в конфигурации планарного эффекта Холла, а также амплитуды спинового тока, возникающего под действием СВЧ-воздействия при ферромагнитном резонансе. Спиновой угол Холла определялся из угловых зависимостей поперечного и продольного спиновых магнитосопротивлений гетероструктуры. Обсуждается влияние шунтирования анизотропным магнитосопротивлением манганитной пленки в гетероструктуре. Для сравнения приводятся данные, полученные на пленке манганита.

> Ключевые слова: спиновый ток, спин-орбитальное взаимодействие, тонкопленочная гетероструктура, магнитосопротивление, иридат стронция, манганит.

DOI: 10.61011/FTT.2024.07.58379.49HH

1. Введение

Экспериментальное изучение процессов возбуждения спинового тока за счет спиновой накачки при ферромагнитном резонансе (ФМР) в F/N структурах (F ферромагнетик, N — металл со спин-орбитальным взаимодействием) и его регистрация за счет обратного спинового эффекта Холла (ISHE) проводилось на контактах Pt с пермаллоем (Py/Pt) и железо-иттриевым гранатом (YIG/Pt) [1-3]. Применение эпитаксиально выращенных оксидных гетероструктур, в частности, 5d иридата стронция SrIrO3 в качестве N материала и 3d ферромагнитного манганита La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃ в последнее время привлекает повышенное внимание [4-6] из-за комбинации электрон-электронного и спин-обитального взаимодействия, а также эффектов, связываемых с возникновением нетривиальных фазовых состояний [7-9]. В частности, в работе [7] было показано, что в иридатной пленке на границе SrIrO₃/La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃ за счет магнитного эффекта близости обнаруживается намагниченность со свойствами, присущими аномальному эффекту Холла. Недавно было продемонстрировано, что увеличение затухания Гильберта в SrIrO₃/La₀ ₇Sr₀ ₃MnO₃гетероструктуре вызвано протеканием спинового тока через границу [6,10,11], а вклад анизотропного магнитосопротивления La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃-пленки обсуждался в работах [4,6,8,10]. Однако температурные зависимости процессов генерации и детектирования спинового тока пока остаются мало изученными. Для оценки эффективности генерации спинового тока (спинового угла Холла) с применением спиновой накачки возникает необходимость иметь дело с большим числом характеристик, таких, как, параметры спектральных линий симметричного и асимметричного откликов, амплитуды и мгновенной фазы магнитной компоненты СВЧ-накачки, спиновой проводимости (spin-mixing conductance) и ряда других (см., например, [10,12]. Задача несколько упрощается, когда спиновый угол Холла определяется из измерений спинового магнитосопротивления и число входящих параметров значительно меньше, однако по вопросу их температурных зависимостей, судя по имеющейся литературе [2,3,13], консенсус пока отсутствует. В настоящей работе приведены результаты измерений температурной зависимости спинового тока, полученной в режиме спиновой накачки и характеристик спинового магнитосопротивления гетероструктуры SrIrO₃/La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃. Для сравнения измерялись также характеристики пленки La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃.

2. Методика

Тонкие эпитаксиальные пленки иридата стронция $SrIrO_3$ и манганита $La_{0.7}Sr_{0.3}MnO_3$ с толщинами 10-50 nm выращивались на монокристаллических подложках (110)NdGaO_3 с помощью радиочастотного магнетронного распыления при температурах подложки

770-800°С в смеси газов Ar и O_2 при полном давлении газов 0.3-0.5 mbar [6].

В SrIrO₃/La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃-гетероструктуре парамагнитная пленка SrIrO₃ выполняла роль нормального металла N с сильным спин-орбитальным взаимодействием (SOI). Ферромагнетик La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃ является магнитным полуметаллом с почти 100% магнитной поляризацией при низких температурах и характеризуется намагниченностью насыщения M = 370 Oe, одноосной анизотропии Hu = 11 Ое и полем насыщения $H_S \approx 14$ Ое при *T* = 300 K [6]. При измерении магнитосопротивления магнитное поле изменялось от нуля до $H = +100 \,\text{Oe}$, затем обратно до $H = -100 \,\mathrm{Oe}$ и завершалось при *H* = 0. Начальной намагниченностью ферромагнитной пленки можно было пренебречь, так как согласно [14] у La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃-пленки толщиной 40 nm начальная намагниченность снижалась от 2 Ое при T = 77 K до 0.5 Ое при *T* = 300 К. С целью исключения влияния магнитной предыстории величина магнитосопротивления бралась при H = -100 Oe.

В режиме ФМР-накачки через SrIrO₃/La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃ границу протекает спиновый ток j_S , который определяется спиновой проводимостью границы $g^{\uparrow\downarrow}$, состоящей из реальной (Re $g^{\uparrow\downarrow}$) и мнимой частей (Im $g^{\uparrow\downarrow}$), а также амплитудой прецессии магнитного момента **m**, вызванного магнитной компонентой внешнего CBЧ-поля [15,16]:

$$\mathbf{j}_{\mathbf{S}} = \frac{h}{4\pi} \left(\operatorname{Re} g^{\uparrow \downarrow} \mathbf{m} \times \frac{d\mathbf{m}}{dt} + \operatorname{Im} g^{\uparrow \downarrow} \times \frac{\mathbf{m}}{dt} \right).$$
(1)

При этом регистрируемый зарядовый ток $j_{\rm Q}$ в двухслойной тонкопленочной структуре определяется величиной спинового угла Холла $\theta_{\rm SH}$

$$\mathbf{j}_{\mathrm{Q}} = \theta_{\mathrm{SH}} \, \frac{2e}{\hbar} \, \left[\mathbf{n} \times \mathbf{j}_{s} \right] \tag{2}$$

где **n** — единичный вектор направления спинового момента.

В результате спиновой накачки зарядовый ток зависит от следующих параметров гетероструктуры $I_Q \propto h f^2 \theta_{\text{SH}} \lambda_N \text{ Re } g^{\uparrow\downarrow}$, где h_f — магнитная компонента СВЧ-накачки, λ_N — длина спиновой диффузии в SrIrO₃, Re $g^{\uparrow\downarrow}$ — реальная часть спиновой проводимости границы SrIrO₃/La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃.

Протекание спинового тока I_S через границу вызывает дополнительное затухание спиновой прецессии. В эксперименте это проявляется в уширении линии спектра ФМР, которое определяется гильбертовым коэффициентом спинового затухания α [15,17,18]. α и ΔH связаны соотношением Параметры $\Delta H(f) = 4\pi \alpha f / \gamma + \Delta H_0$, где f — частота спиновой накачки, γ — гиромагнитное отношение, ΔH_0 уширение, вызванное магнитной неоднородностью гетероструктуры. Отметим, что здесь мы пренебрегаем вкладами других источников затухания. Частотнонезависимое уширение $\Delta H_0 = 6 \pm 1$ Ое мало и определяется магнитной неоднородностью La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃гетероструктуре. Для La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃пленки в пленки получаем $lpha_{\rm LSMO} = 2.0 \pm 0.2 \cdot 10^{-4}$ и затухание увеличивается в SrIrO₃/La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃-гетероструктуре до $\alpha_{\rm SIO/LSMO} = 6.7 \pm 0.8 \cdot 10^{-4}$. Увеличение затухания α после напыления SrIrO₃ позволяет оценить реальную $\operatorname{Re} g^{\uparrow\downarrow}$ спиновой проводимости [6,15,19]. часть намагниченности насыщения La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃-При пленки $M = 370 \,\mathrm{Oe}$ и толщине $d_{\rm LSMO} = 30 \,\rm nm$ Re $g^{\uparrow\downarrow} = (3.5 \pm 0.5) \cdot 10^{18} \,\mathrm{m}^{-2}$. Отметим, получаем что полученное нами значение по порядку величины совпадает с Re $g^{\uparrow\downarrow} = 1.3 \cdot 10^{18} \,\mathrm{m}^{-2}$, определенное в работе [11]. При изменении толщины SrIrO₃-пленки в гетероструктуре от 1.5 до 12 nm величина $\operatorname{Re} g^{\uparrow\downarrow}$ изменяется от 0.5 · 10¹⁹ до 3.6 · 10¹⁹ m⁻² [10].

3. Результаты измерений

3.1. Спиновый ток

По аналогии с методикой исследования спинового тока в структурах Pt/YIG [19] спиновый ток в SrIrO₃/La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃ возбуждался за счет ФМР в пленке La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃ гетероструктуры короткозамкнутой микрополосковой линией. Постоянное магнитное поле Н задавалось в плоскости подложки и было направлено перпендикулярно возникающему за счет ISHE зарядовому току I_O, который регистрировался путем измерения напряжения на образце, имеющим форму полоски из гетероструктуры SrIrO₃/La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃ с металлическими Рt-контактами. Величина IO определялась отношением напряжения отклика к омическому сопротивлению гетероструктуры. Измерения проводились в режиме амплитудной модуляции СВЧ-сигнала с использованием малошумящего синхронного усилителя. Возникновение зарядового тока I_O на пленке SrIrO₃ вследствие ISHE при наличии только лишь спиновой накачки (т.е. при отсутствии измерительного тока I, используемого при измерениях магнитосопротивления) подтверждает возникновение чистого спинового тока Is в SrIrO₃/La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃-гетероструктуре. На рис. 1 показана температурная зависимость амплитуды зарядового тока I_Q. Спектральные линии откликов уширялись с понижением температуры, что приводило к увеличению ошибки измерений, как показано на рис. 1.

3.2. Магнитосопротивление La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃-пленки

Для проведения магниторезистивных измерений пленки $La_{0.7}Sr_{0.3}MnO_3$ и гетероструктуры SrIrO₃/La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃ использовалась 4-х точечная схема, приведенная на рис. 2.

При отсутствии магнитного поля температурные зависимости сопротивления La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃-пленки и SrIrO₃/La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃-гетероструктуры при измерениях продольного (омического) и поперечного (планарного



Рис. 1. Температурная зависимость амплитуды зарядового тока, преобразованного ISHE из спинового тока, возбужденного в режиме ФМР с мощностью СВЧ-накачки 30 mW на частоте f = 2.4 GHz.



Рис. 2. Схема магниторезистивных измерений. Магнитное поле H задавалось в плоскости подложки под углом φ к току, направленному вдоль оси X. θ — угол между осью Z и магнитным моментом M. I — источник задания тока, $V_{\rm T}$ и $V_{\rm L}$ вольтметры, используемые для измерения поперечного (планарного холловского) и продольного (омического) сопротивлений.

холловского) сопротивлений показаны на рис. 3. Параметры сопротивлений R_{L0} , R_{T0} относятся к манганитной пленке, а R_{L0}^{S} , R_{T0}^{S} — гетероструктуре.

Из рис. 3, *а* видно, что оба сопротивления $R_{\rm L0}$ и $R_{\rm T0}$ La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃-пленки уменьшаются с понижением температуры, что типично для манганитных структур. При температуре T = 300 К продольное сопротивление пленки ферромагнетика составляет $R_{\rm L0} = 7.6$ kΩ, тогда как двухслойный образец имеет значение $R_{\rm L0}^{\rm S} = 4.4$ kΩ. Поперечное сопротивление заметно меньше и для La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃ принимает значение $R_{\rm T0} = 17$ Ω, для SrIrO₃/La_{0.7}Sr_{0.3} получено $R_{\rm T0}^{\rm S} = 1.8$ Ω.

Регистрировались магнитно-полевые зависимости изменения нормированного магнитосопротивления гетероструктуры и La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃-пленки от угла φ между магнитным полем *H* и током *I*. Величина продольного магнитосопротивления ферромагнитной La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃пленки *R*_L содержит омическое сопротивление *R*_S и вклад от анизотропного магнитосопротивления (AMR) *R*_A (см. соотношение (3)). Угловая зависимость продольного сопротивления La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃-пленки *R*_L(φ) определяется зависимостью AMR от угла φ и описывается соотношением [20]:

$$R_{\rm L} = R_{\rm S} + R_{\rm A} \cos 2\varphi, \qquad (3)$$

где φ — угол между направлением намагниченности La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃-пленки и направлением задания тока *I*. В манганитах обычно омическое сопротивление $R_{\rm S}$ существенно превышает $R_{\rm A}$. Удельное сопротивление пленки $\rho_{\rm L}$ связано с измеряемым напряжением $V_{\rm L}$ и заданным током *I* следующим соотношением: $\rho_{\rm L} = V_{\rm L}W d_{\rm L}/(LI)$, где *W* — ширина, *L* — длина мостиковой структуры, $d_{\rm L}$ — толщина пленки. При числе квадратов пленки N = L/W = 12.2 сопротивление квадрата пленки $R_{\rm L\Box} = V_{\rm L}W/(LI)$ и в случае La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃-пленки с $d_{\rm L} = 30$ nm, N = 12.2 при T = 300 K и H = 0 $\rho_{\rm L} = 1.86 \cdot 10^{-3}$ Ω cm.

На рис. 4, а в полярных координатах представлена угловая зависимость нормированного продольного магнитосопротивления пленки La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃ $\Delta R_L/R_{L0}$ от φ . Здесь $\Delta R_{\rm L} = R_{\rm L}(H) - R_{\rm L0}$, где $R_{\rm L}(H)$ — сопротивление при магнитном поле, в нашем экспериментальном случае H = 100 Oe, R_{L0} и R_{T0} — сопротивления при H = 0. Для La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃-пленки нормировочный коэффициент брался $R_{L0} = R_{S}$. В результате были получены следующие значения максимумов $(\Delta R_{\rm L}/R_{\rm L0})_{\rm max} = 2.7 \cdot 10^{-4}$, $(\Delta R_{\rm T}/R_{\rm T0})_{\rm max} = 0.014$. Поворот оси максимумов зависимостей относительно нуля вызван отличием направления грани подложки, от которой идет отсчет начала изменения угла φ и направления легкой оси намагниченности La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃-пленки, задаваемой кристаллографическим направлением подложки [001]NdGaO₃ [4]. Сдвиг фаз аппроксимирующего синуса отличается в продольном и поперечном случае и равняется $\varphi_{0L} = 25.3^{\circ}$, $\varphi_{0T} = 15.4^{\circ}.$

Из результатов, представленных на рис. 4, *а* получаем $R_A/R_S = (\Delta R_L/R_{L0})_{max} = 2.7 \cdot 10^{-4}$. При сопротивлении манганитной пленки $R_S = 7613 \Omega$ при T = 300 K следует, что анизотропное магнитосопротивление квадрата La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃ пленки составляет $R_{A\square} = 0.17 \Omega$. В случае поперечного магнитосопротивления ферромагнитной La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃-пленки вклад от омического сопротивления отсутствует и планарное холловское сопротивление $R_{\rm PH}$ определяется планарным эффектом Холла (PHE). Угловая зависимость поперечного сопротивления La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃-пленки $R_{\rm T}(\varphi)$ описывается соотношением [21]:

$$R_{\rm T} = R_{\rm PH} \sin 2\varphi + R_{\rm AH} \cos \theta, \qquad (4),$$



Рис. 3. Температурные зависимости продольного $R_{\rm L}$ и поперечного $R_{\rm T}$ -сопротивлений: $a - {\rm La}_{0.7}{\rm Sr}_{0.3}{\rm MnO}_3$ — пленки толщиной 30 nm, b — гетероструктура SrIrO₃/La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃ с $d_N = 10$ nm.



Рис. 4. Нормированные зависимости магнитосопротивления La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃-пленки: *a* — в продольном направлении, *b* — поперечный случай.

где амплитуда $R_{\rm PH}$ соответствует вкладу от планарного эффекта Холла, а второй член в (4) определяется отклонением намагниченности пленки от плоскости и возникновением аномального холловского сопротивления (AHE) $R_{\rm AH}$ в ферромагнетике из-за перпендикулярной к X-Y плоскости составляющей намагниченности. При наших измерениях магнитное поле H и ток Iнаходились в плоскости подложки ($\theta \approx 90^\circ$ — угол между намагниченностью и осью Z). Обычное холловское сопротивление $R_{\rm OH}$ измеряется при перпендикулярно направленном поле H и определяется электронными носителями в пленке. Поскольку компонента магнитного поля вдоль оси Z (см. рис. 2) отсутствует, то $R_{\rm OH} = 0$ и $R_{\rm T}$ определяется только лишь малым вкладом АНЕ из-за малости намагниченности вдоль оси Z.

На рис. 4, *b* в полярных координатах показаны величины нормированного планарного холловского сопротивления $\Delta R_{\rm T}/R_{\rm T0}$, где $\Delta R_{\rm T} = R_{\rm T}(H) - R_{\rm T0}$, где $R_{\rm T}(H)$ — магнитосопротивление при H = 100 Ое. В качестве нормировочного параметра выбрано сопротивление $R_{\rm T0} = R_{\rm AH}$, которое определяется из данных по поперечному сопротивлению при H = 0, приведенных на рис. 3. Максимальное значение отношения $\Delta R_{\rm T}/R_{\rm T0} = R_{\rm A}/R_{\rm AH} = 0.014$. При T = 300 К $R_{\rm T0} = 17$ Ω получаем планарное холловское магнитосопротивление "условного" квадрата LSMO пленки $R_{\rm PH\square} = 0.24$ Ω.

3.3. Магнитосопротивление гетероструктуры SrlrO₃/La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃

На спиновое магнитосопротивление (SMR) гетероструктуры с ферромагнетиком влияет спиновый эффект Холла, который определяется спиновым углом Холла θ_{SH} : Для продольного магнитосопротивления гетеро-



Рис. 5. Угловые зависимости от угла φ нормированного спинового магнитосопротивления гетероструктуры SrIrO₃/La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃: a — продольного, b — поперечного.

структуры нормальный металл/ферромагнитный изолятор имеем [20]:

$$R_{\rm L}^{\rm S} \approx R_N + R_1 + R_2 \cos 2\varphi, \qquad (5)$$

$$R_1 = -R_N \Theta_{\rm SH}^2 \lambda_N / d_N, \qquad (6)$$

$$R_{2} = R_{N}\theta_{\rm SH}^{2} \frac{\lambda_{N}}{d_{N}} \operatorname{Re} \frac{2\lambda_{N}\rho_{N}(\operatorname{Re} G^{\uparrow\downarrow}) + i\operatorname{Im} G^{\uparrow\downarrow}}{1 + 2\lambda_{N}\rho_{N}(\operatorname{Re} G^{\uparrow\downarrow}) + i\operatorname{Im} G^{\uparrow\downarrow}}, \quad (7)$$

где Re $G^{\uparrow\downarrow}$ = Re $g^{\uparrow\downarrow}e^2/h$, Im $G^{\uparrow\downarrow}$ = Im $g^{\uparrow\downarrow}e^2/h$. При Re $g^{\uparrow\downarrow} \approx \text{Im } g^{\uparrow\downarrow}$, удельном сопротивлении SrIrO₃ пленки $\rho_N = 3 \cdot 10^{-4} \,\Omega \,\mathrm{cm}$ и толщинах пленок SrIrO₃ $d_N = 10 \text{ nm}$ и La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃ $d_F = 30 \text{ nm}$ [4] дополнительный член Re $\frac{2\lambda_N\rho_N(\text{Re}G^{\uparrow\downarrow})+i\,\text{Im}\,\text{G}^{\uparrow\downarrow}}{1+2\lambda_N\rho_N(\text{Re}\,G^{\uparrow\downarrow})+i\,\text{Im}\,\text{G}^{\uparrow\downarrow}}$, обусловлен спиновым импедансом границы, при Re $g^{\uparrow\downarrow}=1.3\cdot 10^{18}\,\mathrm{m}^{-2}$ дает коэффициент порядка 0.55. При выводе выражений (5)-(7) в [21] предполагается, что сопротивление нормального металла велико $R_N \gg R_1$, R_2 , а длина спиновой диффузии λ_N много меньше толщины d_N (в нашем случае пленки SrIrO₃). В случае электропроводящего ферромагнетика влияние нижней пленки La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃ на магнитосопротивление гетероструктуры необходимо учитывать дополнительно. Сравнение выражений (1)-(2) и выражений (5)-(7) показывает, что зависимость магнитосопротивления от угла ϕ гетероструктуры существенно не отличается от La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃-пленки. При этом наличие спинового магнитосопротивления в гетероструктуре (в отличие от пленки, где наблюдается анизотропное магнитосопротивление) приводит к эффектам, выявляемым экспериментально. Наблюдается уменьшение постоянного (не зависящего от угла ϕ) значения магнитосопротивления на величину R_1 (5). Как следует из (3)-(7) в эксперименте наблюдается одинаковая угловая зависимость продольного АМРмагнитосопротивления La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃-пленки (амплитуда изменения R_A) и SMR гетероструктуры (член R_2).

Физика твердого тела, 2024, том 66, вып. 7

При этом сопротивление R_A шунтирует R_2 т. к. соединены параллельно.

На рис. 5, *а* представлена в полярных координатах угловая зависимость продольного SMR гетероструктуры SrIrO₃/La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃. $\Delta R_{\rm L}(\varphi) = R_{\rm L}^{\rm S}(H) - R_{\rm L0}^{\rm S}$ нормированного на $R_{\rm L0}^{\rm S}$ при H = 0. Из данных рис. 5, *а* имеем $\Delta R_{\rm L}/R_{\rm L0}^{\rm S} = 1.7 \cdot 10^{-4}$, $\varphi_{0\rm L} = 74.1^{\circ}$. Используя соотношение (7), получаем значение спинового угла Холла $\theta_{\rm SH} = 0.04$ при $\lambda_N = 1.5$ nm и толщине пленки $d_N = 10$ nm. Следует заметить, что оценка величины $\theta_{\rm SH}$ получена без учета шунтирующего влияния сопротивления $R_{\rm A}$ AMR. La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃-пленки, которое может играть определяющую роль при условии $R_{\rm A} \ll R_2$, когда в измеряемом SMR гетероструктуры превалирует AMR La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃-пленки.

Совершенно иная ситуация наблюдается для случая измерения спинового магнетосопротивления из данных по поперечному магнитосопротивлению. На рис. 5, b зависимость представлена угловая поперечного (планарного холловского) магнитосопротивления $SrIrO_3/La_{0.7}Sr_{0.3}MnO_3$ -гетероструктуры. При T = 300 K(рис. 5) получаем $\Delta R_T/R_{T0}^S = 0.049$ и $\varphi_{0L} = 129.1^\circ$. Здесь угловая зависимость изменения магнитосопротивления $\Delta R_{\rm T}(\phi)$ определяется спиновым SMRмагнитосопротивлением с амплитудой R₂. Вклады от R₃ и от аномального холловского магнитосопротивления $R_{\rm AH}$ не зависят от угла φ [7,21]:

 $R_{\rm T}^{\rm S} = \frac{R_2}{2} \sin^2 \varphi + R_3 \cos \theta + R_{\rm AH} \cos \theta, \qquad (8)$

где

$$R_{3} = R_{N}\theta_{\rm SH}^{2} \frac{\lambda_{N}}{d_{N}} \operatorname{Im} \frac{2\lambda_{\rm S}\rho_{\rm S}(\operatorname{Re} G^{\uparrow\downarrow} + i \operatorname{Im} G^{\uparrow\downarrow})}{1 + 2\lambda_{\rm S}\rho_{\rm S}(\operatorname{Re} G^{\uparrow\downarrow}) + i \operatorname{Im} G^{\uparrow\downarrow})}.$$
 (9)

В поперечном случае магнитосопротивление La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃-пленки определяется планарным эффектом Холла (4). Второй член в выражении (8), зависящий



Рис. 6. *а* — температурные зависимости изменения нормированного поперечного спинового SMR-магнитосопротивления гетероструктуры SrIrO₃/La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃ и планарного холловского магнитосопротивления пленки La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃. Здесь $\Delta R_{\rm T} = RT(H = 100_{\rm Oe}) \cdot R_{\rm T0}$. *b* — температурная зависимость спинового угла Холла $\theta_{\rm SH}$, полученная из поперечного магнитосопротивления гетероструктуры SrIrO₃/La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃ — черные квадраты. Звездочки — зависимость $\theta_{\rm SH}(T)$ для SrIrO₃/CoTb из работы [13].

от мнимой части комплексной спиновой проводимости, возникает из-за намагниченности, направленной перпендикулярно плоскости подложки и может вызвать увеличение магнитосопротивления, что наблюдалось в сверхрешетках SrIrO₃/La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃ [8]. В нашем случае имеем одиночную границу раздела SrIrO₃/La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃. Предполагая $R_3 \ll R_{AH}$, в качестве нормировки используем величину R_{AH}, полученную из данных, приведенных на рис. 3. В результате, при температуре вблизи $T = 300 \,\mathrm{K} \,\Delta R_{\mathrm{T}}(\varphi)/R_{\mathrm{AH}} = 0.11$ получаем $\theta_{\mathrm{SH}} = 0.79$, что примерно на порядок превосходит величину $\theta_{\rm SH}$, оцененную из продольного SMR магнитосопротивления, полученную без учета шунтированием магнитосопротивлением AMR пленки La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃ [6]. Заметим, что $\theta_{\rm SH} \cong 0.3$ было получено в гетероструктурах SrIrO₃/La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃ [22] другими методами. О высоких значениях спинового угла Холла в структурах с пленками SrIrO₃ сообщалось ранее: $\theta_{SH} = 0.76$ для Ру/SrIrO₃ [23] и $\theta_{SH} = 1.1$ для SrIrO₃/Co_{1-x}Tb_x [13]. По порядку величин эти значения близки к θ_{SH} , наблюдаемым в структурах с топологическими изоляторами [8].

3.4. Температурная зависимость магнитосопротивления

Как видно из рис. 1 с понижением температуры ниже температуры Кюри $T_{\rm CU}$ манганита амплитуда спинового тока сначала растет, а затем выходит на насыщение или даже немного спадает (в пределах ошибки). Однако, из-за сложности оценки вклада от анизотропного магнитосопротивления ферромагнетика в измеряемый отклик в условиях спиновой накачки температурную зависимость спинового угла Холла будем проводить на основе данных по SMR. С целью исключения шунтирующего влияния манганитной пленки будем обсуждать температурную зависимость поперечного SMR спинового магнитосопротвления, приведенную на рис. 6, а. Для сравнения на этом же рисунке приведена температурная зависимость для манганитной пленки, которая по амплитуде значительно меньше, чем в гетероструктуре и также зануляется при $T = T_{CU}$. Видно, что в случае гетероструктуры с повышением температуры от T_{CU} до $T \approx 300 \,\mathrm{K}$ наблюдается рост $\Delta R_{\mathrm{T}}/R_{\mathrm{T0}}^{\mathrm{S}}$, а затем имеет место спад с понижением температуры. Основной вклад в изменение поперечного сопротивления R_T дает член R_2 в (7), а нормировочный параметр R_{T0}^{S} определяется сопротивлением $R_{\rm AH}$. Температурная зависимость SMRмагнитосопротивления, из которой можно извлечь зависимость $\theta_{\rm SH}(T)$, определяется отношением $R_2/R_{\rm AH}$, которое содержит несколько зависящих от температуры компонент $\lambda_N(T)$, $g^{\uparrow\downarrow}(T)$ и $R_{AH}(T)$. Длина спиновой диффузии $\lambda_N(T)$ обычно определяется релаксацией Элиотта-Яфета и изменяется с температурой обратно пропорционально сопротивлению нормального металла [2] в гетероструктуре, в нашем случае в SrIrO₃. Удельное сопротивление SrIrO₃ слабо зависит от температуры в интервале от 77 К до комнатной [4] и изменением с температурой удельного сопротивления SrIrO₃-пленки на интервале температур на рис. 6, а можно пренебречь. Исходя из выводов работы [3], позволяющим пренебречь практически не зависящей от температуры зависимостью $\lambda_N(T)$ на обсуждаемом температурном интервале, изменения поперечного магнитосопротивления в гетероструктуре будет определяться вкладами от $R_{\rm AH}(T)$, представленной на рис. 3, *a*, а также $\theta_{SH}^2(T)$ и $g^{\uparrow\downarrow}(T)$, которая зависит от эффективной намагниченности М ферромагнитного слоя [10]. В работе [24] была получена зависимость Re $g^{\uparrow\downarrow}(T)$ для структуры Pt/La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃, предсказывающая рост параметра Re g^{↑↓} при понижении температуры. Связь спинового угла Холла $\theta_{\rm SH}$ и параметра Re $g^{\uparrow\downarrow}$ следует из соотношений (1) и (2), однако данных, приведенных на рис. 1, подтверждающих генерацию спинового тока, недостаточно для извлечения функциональной зависимости $\theta_{\rm SH}(T)$ гетероструктуры SrIrO₃/La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃.

На рис. 6, *b* приведена зависимость $\theta_{SH}(T)$, рассчитанная по (7) и (8), используя данные рис. 6, а и полагая Re $G^{\uparrow\downarrow} = 1.35 \cdot 10^{10} \,\mathrm{cm}^{-2} \Omega^{-1}, \ d_N = 10 \,\mathrm{nm}, \ \lambda_N = 1.5 \,\mathrm{nm},$ $R_3 = 0$. Для сравнения на этом же рисунке приведены значения $\theta_{SH}(T)$ из работы [13] для гетероструктуры SrIrO₃/CoTb с аналогичной нашему случаю толщиной SrIrO₃ 10 nm и ферромагнетиком CoTb толщиной 6 nm. Видно, что на обеих структурах с пленкой SrIrO₃ спиновый угол Холла спадает с понижением температуры от комнатной T = 300 K, что не совпадает с температурным поведением Repaботы [24] для данного интервала температур. С повышением температуры от $T = 300 \,\mathrm{K}$ до $T = 350 \,\mathrm{K}$ (температуры Кюри манганита) спад $\theta_{\rm SH}(T)$ объясняется ожидаемым снижением намагниченности в манганитной пленке и совпадает с поведением Re $g^{\uparrow\downarrow}$ работы [24]. Природа особенности на функции $\theta_{\rm SH}(T)$ вблизи $T = 150\,{\rm K}$ пока не ясна и требует дополнительного изучения.

4. Заключение

В гетероструктуре SrIrO₃/La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃ в режиме спиновой накачки на частоте $\Phi MP f = 2.4 \, \text{GHz}$ амплитуда зарядового тока $I_{\mathrm{Q}}= heta_{\mathrm{SH}}I_{\mathrm{S}}$ (пропорционального спиновому току $I_{\rm S}$ через параметр $\theta_{\rm SH}$) монотонно возрастала примерно в 1.5 раза с понижением температуры от комнатной до 250 К. При дальнейшем охлаждении от 200 до 77К не удается определить изменение I_O с температурой из-за увеличения ошибки измерений и при T < 120 K отклик уже не обнаруживался. Для оценки спинового угла Холла $\theta_{\rm SH}$ проводились измерения анизотропного и спинового магнитосопротивлений SrIrO₃/La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃-гетероструктуры и пленки La0.7Sr0.3MnO3 в конфигурации планарного эффекта Холла. Из температурных зависимостей изменения нормированного поперечного магнитосопротивления гетероструктуры SrIrO₃/La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃ и отдельной манганитной пленки, можно прийти к выводу, что в случае гетероструктуры изменение поперечного спинового магнитосопротивления в максимуме примерно в пять раз превышает значение, полученное для планарного холловского магнитосопротивления пленки La_{0.7}Sr_{0.3}MnO₃.

Благодарности

Авторы благодарны Ю.В. Кислинскому, А.А. Климову, А.М. Петржику за помощь в проведении эксперимента и полезные обсуждения.

Финансирование работы

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 23-79-00010).

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- O. Mosendz, V. Vlaminck, J.E. Pearson, F.Y. Fradin, W.G.E. Bauer, S.D. Bader, A. Hoffmann. Phys. Rev. B 82, 21, 214403-1-9 (2010).
- [2] S.R. Marmion, M. Ali, M. McLaren, D.A. Williams, B.J. Hickey. Phys. Rev. B 89, 220404(R) (2014).
- [3] M. Althammer, S. Meyer, H. Nakayama, M. Schreier, S. Altmannshofer, M. Weiler, H. Huebl, S. Geprägs, M. Opel, R. Gross, D. Meier, C. Klewe, T. Kuschel, J-M. Schmalhorst, G. Reiss, L. Shen, A. Gupta, Y-T. Chen, G.E.W. Bauer, E. Saitoh, S.T. Goennenwein. Phys. Rev. B 87, 22, 224401-1-15 (2016).
- [4] G.A. Ovsyannikov, T.A. Shaikhulov, K.L. Stankevich, Yu. Khaydukov, N.V. Andreev. Phys. Rev. B 102, 144401 (2020).
- [5] К.И. Константинян Г.Д. Ульев, Г.А. Овсянников, В.А. Шмаков, А.В. Шадрин, Ю.В. Кислинский. ФТТ 65, 7, 1176 (2023).
- [6] G.A. Ovsyannikov, K.Y. Constantinian, V.A. Shmakov, A.L. Klimov, E.A. Kalachev, A.V. Shadrin, N.V. Andreev, F.O. Milovich, A.P. Orlov, P.V. Lega. Phys. Rev. B 107, 14, 144419-1-12. (2023).
- [7] M.-W. Yoo, J. Tornos, A. Sander, L.-F. Lin, N. Mohanta, A. Peralta, D. Sanchez-Manzano, F. Gallego, D. Haskel, J.W. Freeland, D.J. Keavney, Y. Choi, J. Strempfer, X. Wang, M. Cabero, H. B. Vasili, M. Valvidares, G. Sanchez-Santolino, J.M. Gonzalez-Calbet, A. Rivera, C. Leon, S. Rosenkranz, M. Bibes, A. Barthelemy, A. Anane, E. Dagotto, S. Okamoto, S.G.E. te Velthuis, J. Santamaria, J.E. Villegas. Nature Commun. 12, 3283 (2021).
- [8] D. Yi, J. Liu, S.L. Hsu, L. Zhang, Y. Choi, J.W. Kim, Z. Chen, J.D. Clarkson, C.R. Serrao, E Arenholz, P.J.Ryan, H. Xu, R.J. Birgeneau, R. Ramesh. Proc. Nat. Ac. Sci. 113, 23, 6397 (2016).
- [9] D. Yi, H. Amari, P.P. Balakrishnan, C. Klewe, P. Shafer, N. Browning, Y. Suzuki. Phys. Rev. Appl. 15, 2, 024001-1-9 (2021).
- [10] X. Huang, S. Sayed, J. Mittelstaedt, J. Mittelstaedt, S. Susarla, S. Karimeddiny, L. Caretta, H. Zhang, V.A. Stoica, T. Gosavi, F. Mahfouzi, Q. Sun, P. Ercius, N. Kioussis, S. Salahuddin, D.C. Ralph, R. Ramesh. Adv. Mater. 2008269 (2021).
- [11] J. Dubowik, P. Graczyk, A. Krysztofik, H. Głowinski, E. Coy, K. Załeski, I. Goscianska. Phys. Rev. Appl. 13, 054011 (2020).
- [12] A. Azevedo, L.H. Vilela-Leão, R.L. Rodríguez-Suárez, A.L. Santos, S.M. Rezende. Phys. Rev. B 83, 14, 144402-1-6. (2011).
- [13] H. Wang, K.Y. Meng, P. Zhang, J.T. Hou, J. Finley, J. Han, F. Yang, L. Liu. Appl. Phys. Lett. **114**, 23, 232406-1-5. (2019).
- [14] F. Congiu, C. Sanna, L. Maritato, P.Orgiani, A.G. Lehmann. JMMM **420**, 88 (2016).

- [15] Ya. Tserkovnyak, A. Brataas, G.E.W. Bauer. Phys. Rev. Lett. 88, 117601 (2002).
- [16] J. Sinova, S.O. Valenzuela, J. Wunderlich, C.H. Back, T. Jungwirth. Rev. Mod. Phys. 87, 1213 (2015).
- [17] M. Zwierzycki, Ya. Tserkovnyak, P.J. Kelly, A. Brataas, G.E. Bauer. Phys. Rev. B 71, 6, 064420-1-11 (2005).
- [18] T. Nan, T.J. Anderson, J. Gibbons, K. Hwang, N. Campbell, H. Zhou, Y.Q. Dong, G.Y. Kim, D.F. Shao, T.R. Paudel, N. Reynolds, X.J. Wang, N.X. Sun, E.Y. Tsymbal, S.Y. Choi, M.S. Rzchowski, Y.B. Kim, D.C. Ralph, C.B. Eom. Proc. Nat. Acad. Sci. USA, **116**, 16186 (2019).
- [19] J. Dubowik, P. Graczyk, A. Krysztofik, H. Głowinski, E. Coy, K. Załeski, I. Goscianska. Phys. Rev. Appl. 13, 054011 (2020).
- [20] G.A. Ovsyannikov, K.Y. Constantinian, K.L. Stankevich, T.A. Shaikhulov, A.A. Klimov. J. Phys. D 54, 365002 (2021).
- [21] Y.-T. Chen, S. Takahashi, H. Nakayama, M. Althammer, S.T.B. Goennenwein, E. Saitoh, G. E.W. Bauer. J. Phys.: Condens. Matter 28, 103004 (2016).
- [22] A.S. Everhardt, M. DC, X. Huang, S. Sayed, T.A. Gosavi, Y. Tang, C.-C. Lin, S. Manipatruni, I.A. Young, S. Datta, J.-P. Wang, R. Ramesh. Phys. Rev. Mater. 3, 051201 (2019).
- [23] T. Nan, T.J. Anderson, J. Gibbons, K. Hwang, N. Campbell, H. Zhou, Y.Q. Dong, G.Y. Kim, D.F. Shao, T.R. Paudel, N. Reynolds, X.J. Wang, N.X. Sun, E.Y. Tsymbal, S.Y. Choi, M.S. Rzchowski, Y.B. Kim, C.B. Eom. Proc. Nat. Acad. Sci. USA. **116**, *33*, 16186 (2019).
- [24] В.А. Ацаркин, В.В. Демидов, Т.А. Шайхулов. ЖЭТФ 157, 272 (2020).

Редактор Ю.Э. Китаев